

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

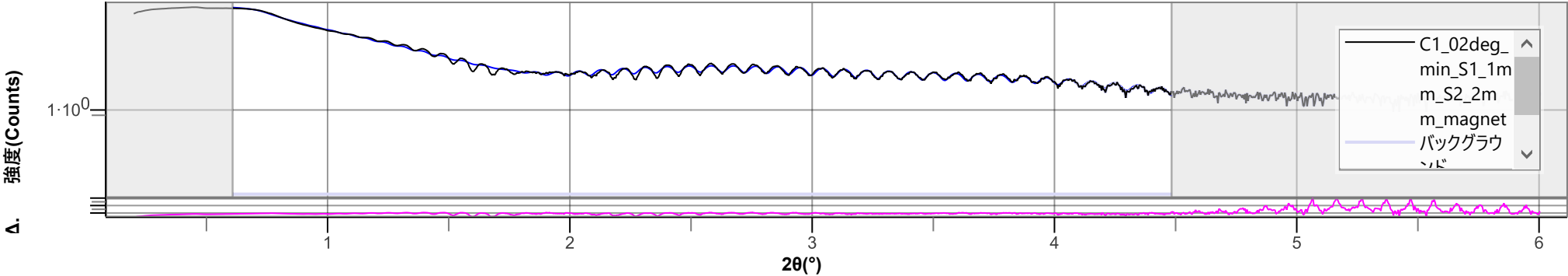
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg<		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.166	Const	4.83766	Const	0.247	Con...	
				±0.011	精密化	±0.06	→最大 精密化	±0.008	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	2.213	Const	2.63518	Const	0.100	Con...	
				±0.019	精密化	±0.018	最小← 精密化	±0.04	最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe	5.491	Const	7.87398	Const	0.295	Con...	
				±2	精密化	±0.02	→最大 精密化	±0.012	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	86.009	Const	7.14647	Const	0.467	Con...	
				±0.02	精密化	±0.03	→最大 精密化	±0.02	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.818	Const	5.08188	Const	0.100	Con...	
				±0.07	精密化	±0.04	精密化	±0.04	最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	